

English Version

**Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions,  
150 kHz to 1 GHz - Part 4: Measurement of conducted  
emissions - 1 ohm/150 ohm direct coupling method  
(IEC 61967-4:2002/COR1:2017)**

Circuits intégrés - Mesure des émissions  
électromagnétiques, 150 kHz à 1 GHz - Partie 4: Mesure  
des émissions conduites - Méthode par couplage direct 1  
ohm/150 ohm  
(IEC 61967-4:2002/COR1:2017)

Integrierte Schaltungen - Messung von  
elektromagnetischen Aussendungen im Frequenzbereich  
von 150 kHz bis 1 GHz - Teil 4: Messung der  
leitungsgeführten Aussendungen - Messung mit direkter 1  
Ohm/150 Ohm-Kopplung  
(IEC 61967-4:2002/COR1:2017)

This corrigendum becomes effective on 21 July 2017 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

### **Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 61967-4:2002/COR1:2017 was approved by CENELEC as EN 61967-4:2002/AC:2017-07 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**IEC 61967-4**  
Edition 1.0 2002-04

**Integrated circuits – Measurement of  
electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz**

**Part 4:  
Measurement of conducted emissions –  
1  $\Omega$ /150  $\Omega$  direct coupling method**

**IEC 61967-4**  
Édition 1.0 2002-04

**Circuits intégrés – Mesure des émissions  
électromagnétiques, 150 kHz à 1 GHz**

**Partie 4:  
Mesure des émissions conduites –  
Méthode par couplage direct 1  $\Omega$ /150  $\Omega$**

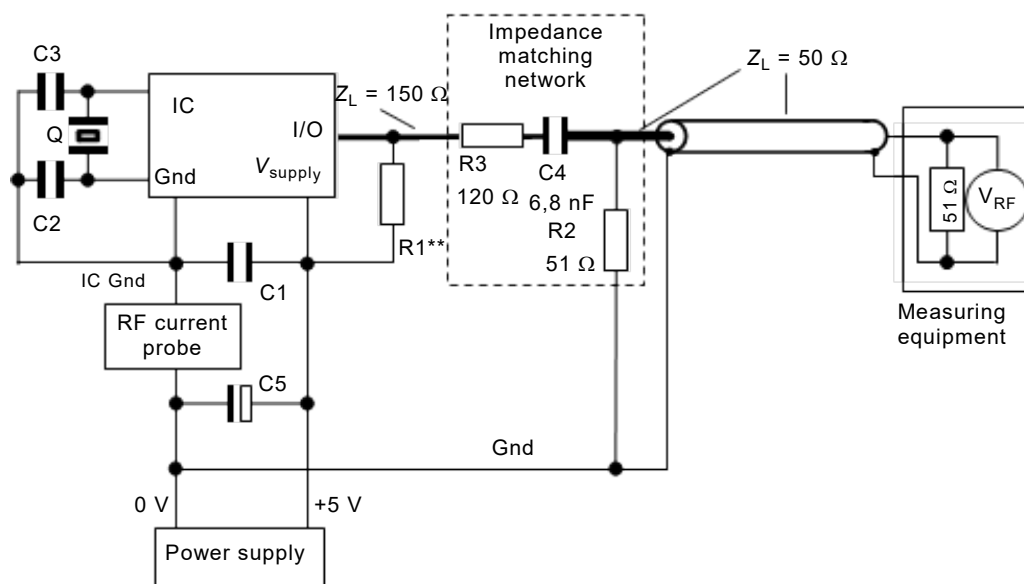
**CORRIGENDUM 1**

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

**7.1 General test configuration**

Replace the existing Figure 5 by the following new Figure 5:



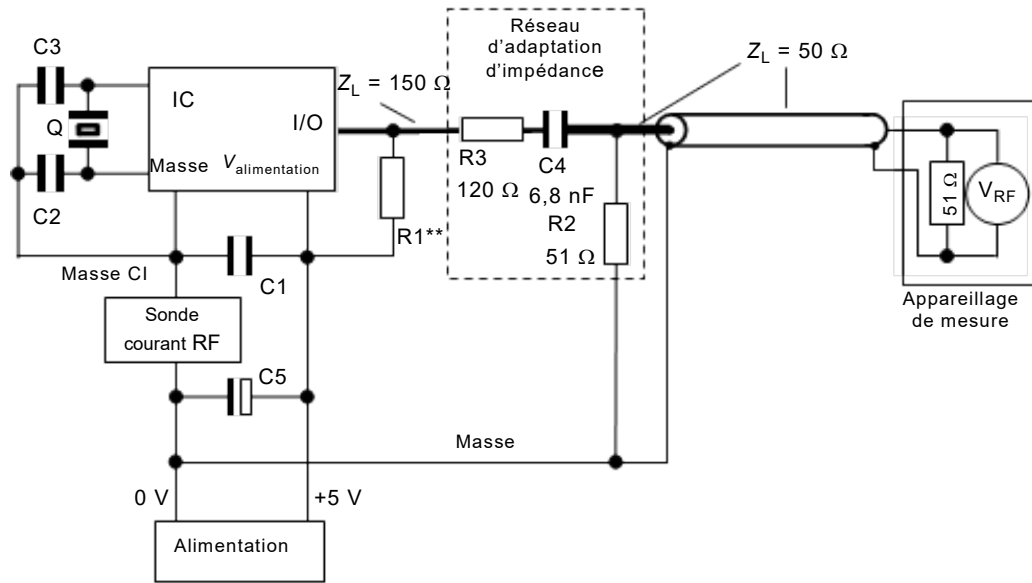
\*\* pull up / pull down may be required depending on application

IEC

**Figure 5 – General test configuration**

### 7.1 Configuration générale d'essai

Remplacer la Figure 5 existante par la nouvelle Figure 5 suivante:



\*\* Une résistance de polarisation à l'alimentation/à la masse peut être requise en fonction de l'application

IEC

Figure 5 – Configuration générale d'essai